

Lecture of IEEE Overlaps & Prof. Svoboda Distinguished Lecture

Yield & Robustness in Today's Advanced Technology Nodes



Language:

English

Date:

18.3.2016

Time:

11:00

Place:

Lecture hall

T9:155

FIT CTU in Prague

Thákurova 9, Prague



ctu-sb.ieee.cz

Dr. Yervant Zorian

*Fellow and Chief Architect at Synopsys
President of IEEE Test Technology Technical Council*



Víte, co je to FinFET?

What is FinFET?

Jak opravovat čipy za běhu?

How to repair chips online?

Jak probíhá návrh, výroba a testování moderních integrovaných obvodů?

How to design, manufacture, and test the advanced integrated circuits?

Dr. Yervant Zorian je jeden z nejuznávanějších světových expertů v oblasti návrhu a testování integrovaných obvodů a jeden z nejvýznamnějších představitelů IEEE.

Dr. Yervant Zorian is a leading expert in design and test of integrated circuits and one of the major representatives of IEEE.